

Modell alapú tesztelés

Majzik István

BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Tartalomjegyzék

- **Motiváció**
 - Modellek (informális) szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- **Tesztgenerálás hibakészlet alapján**
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

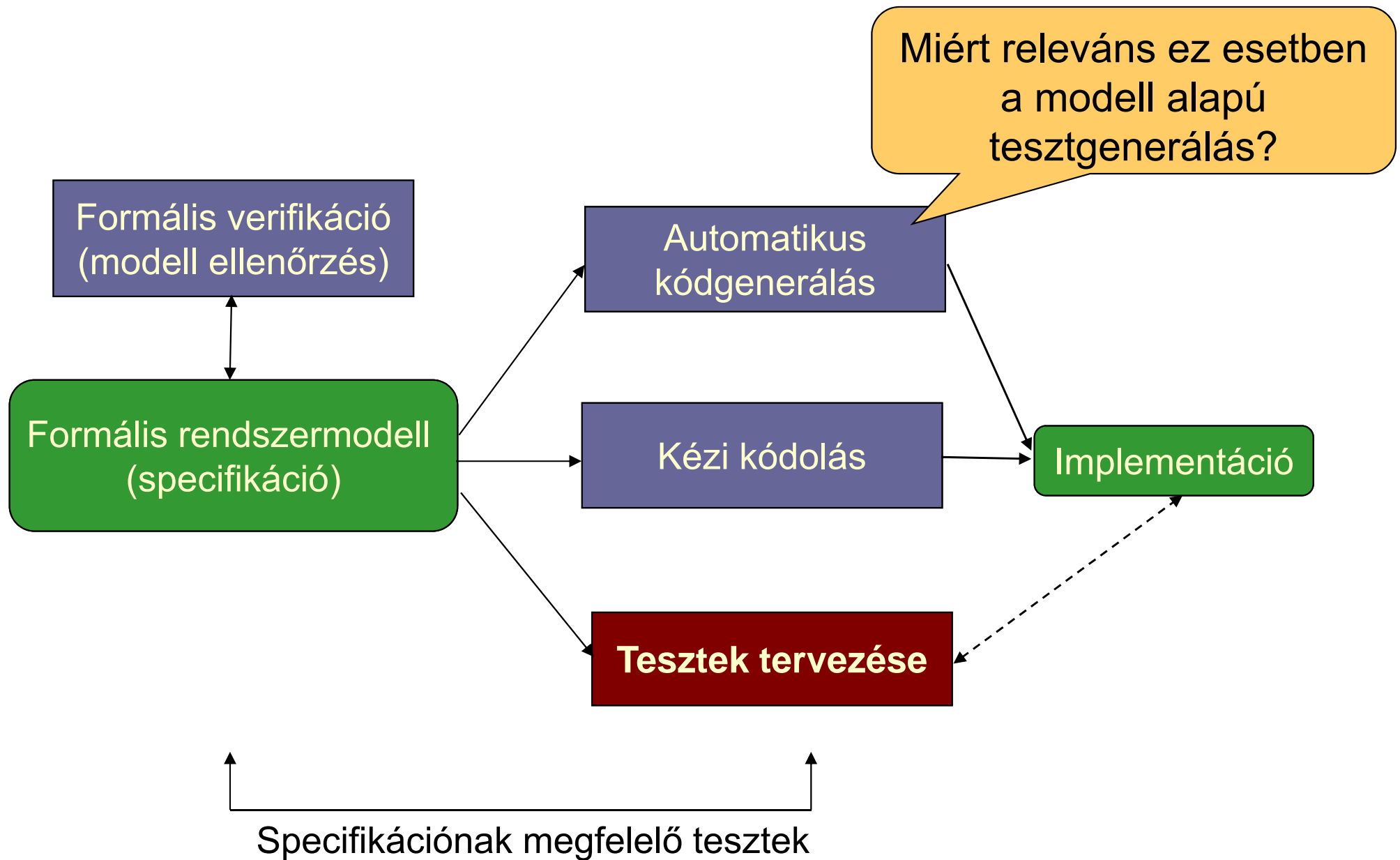
Modell alapú tervezés (UML) és tesztelés

- Használati eset diagram:
 - Validációs tesztelés: tesztelendő használati esetek
- Osztály- és objektumdiagram
 - Modultesztelés: komponensek, interfészek azonosítása
- Állapottérkép és aktivitás diagram:
 - Modultesztelés: referencia struktúra alapú teszteléshez
- Üzenet-szekvencia és együttműködési diagram:
 - Integrációs tesztelés: forgatókönyvek származtatása
- Komponens diagram:
 - Rendszertesztelés: tesztelendő fizikai komponensek
- Telepítés diagram:
 - Rendszertesztelés: teszt konfiguráció

Tartalomjegyzék

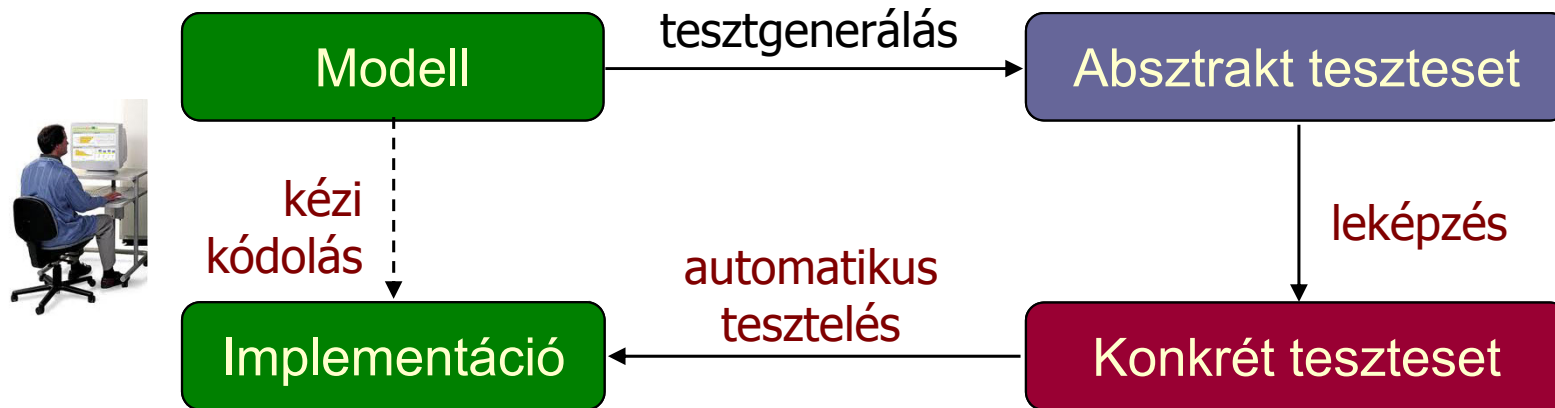
- **Motiváció**
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - **Modell alapú tesztgenerálás**
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- **Tesztgenerálás hibakészlet alapján**
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)



Használati esetek

- Kézi kódolás esetén: Konformancia ellenőrzés

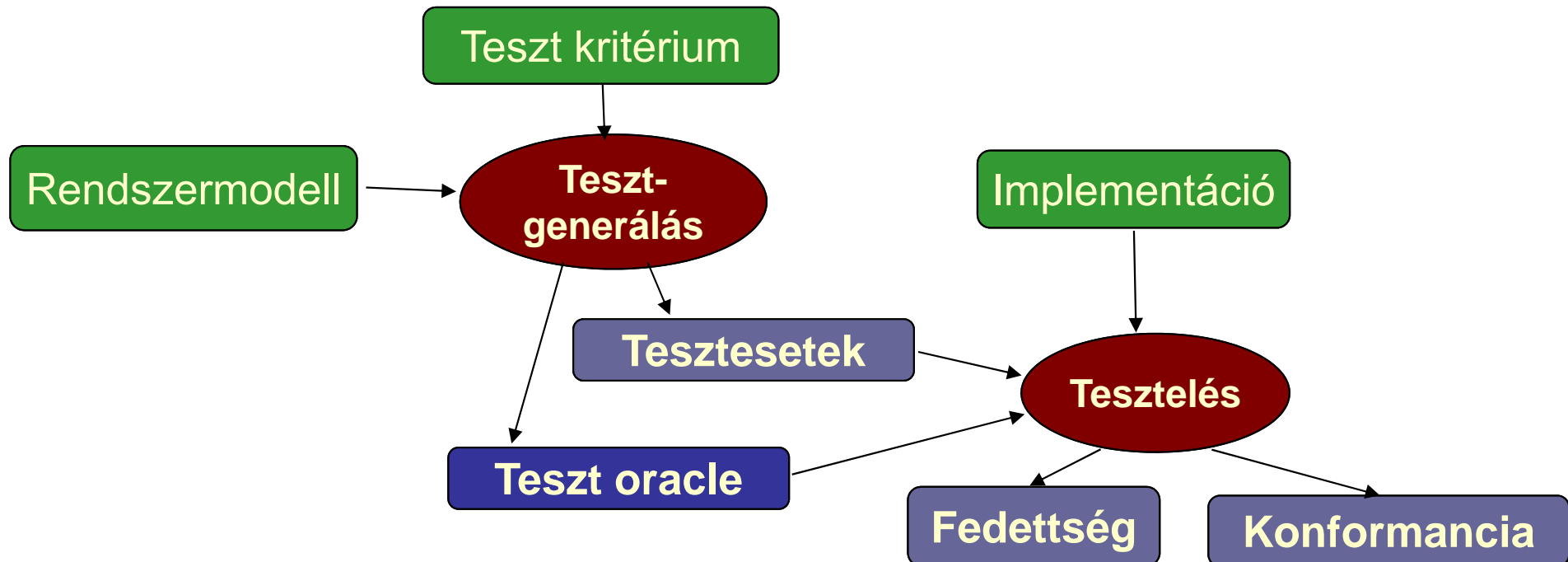


- Automatikus kódgenerálás esetén: Validáció



Modell alapú tesztelés alapfeladatai

- Rendszermodell és tesztelési kritérium alapján:
 - Tesztgenerálás (viselkedéshez, fedettséghez)
 - Teszt kiértékelő (test oracle) generálás
 - Teszt fedettség meghatározása
 - Konformancia megállapítása



Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - **Direkt algoritmusok**
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- Tesztgenerálás hibakészlet alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

Tipikus alkalmazási terület

- **Állapot alapú, eseményvezérelt működés**
 - Eseményre triggerelt állapotátmenetek
 - Akciók (mint válasz jellegű kimenetek)
- **Felhasználói felületek tesztelése**
 - Eseményvezérelt működés
- **Egyszerű modellek használhatók**
 - Automaták (FSM; Mealy, Moore, Büchi, ...)
 - Magasabb szintű formalizmusok leképezhetők
 - UML állapottérkép
 - SCADE Safe Statechart
 - Simulink Stateflow
- **Gráfelméleti algoritmusok**
 - Algoritmus létezik sokféle tesztelési feladathoz
 - Optimális tesztek: Tipikusan NP-teljes algoritmusok ☹️

Gráfelméleti algoritmus átmenet fedéshez

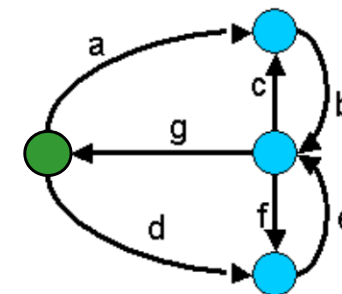
- Problémák megfeleltetése

- Tesztelési probléma: **Átmenetek fedése**

- Minden átmenet fedése teszt szekvenciával
 - A teszt szekvencia vigyen vissza a kezdeti állapotba

- Gráfelméleti probléma: **„New York-i utcaseprő” probléma**

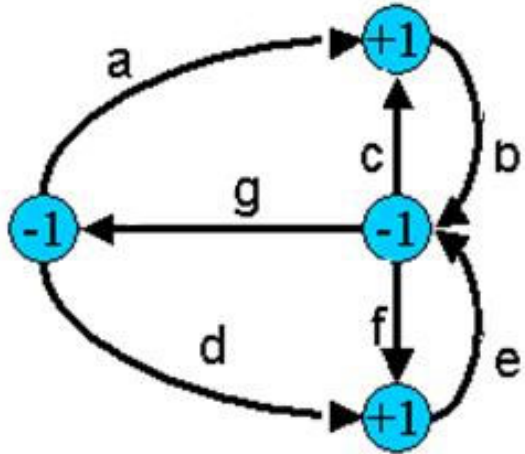
- Egy irányított gráfban mi az a (legrövidebb) bejárási szekvencia, ami minden élet bejár és a kezdeti helyre visz vissza?
 - (Ugyanez nem irányított gráfban: Kínai postás probléma)



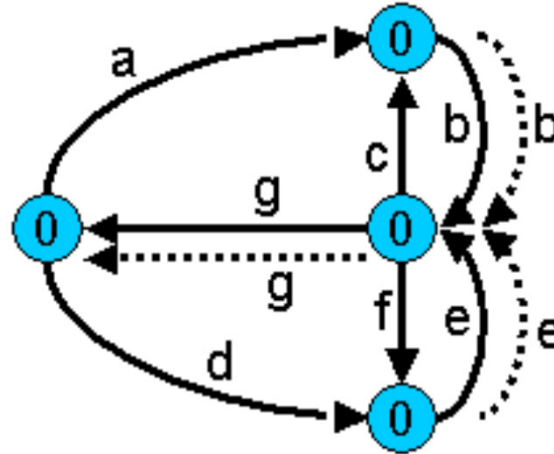
- Megoldás alapötlete:

- Helyek polaritásainak számítása: Bejövő mínusz kimenő élek száma
 - Olyan élek duplikálása, amelyek pozitívtól negatív polaritású helyekig vezetnek, amíg minden hely nulla polaritású nem lesz
 - Euler-kör keresése az így adódó gráfban (lineáris algoritmus)
 - Euler-kör: Minden élet bejár; ilyen gráfban biztosan képezhető
 - Az Euler-kör bejárása adja a teszt szekvenciát

Egy példa átmenet fedéshez



Eredeti gráf
hely polarításokkal



Duplikált élekkel
kiegészített gráf (Euler-gráf)

Bejárási szekvencia (Euler-kör):

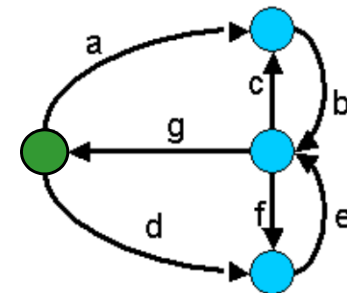
a b c b f e g d e g

Gráfelméleti algoritmus átmenet kombináció fedéshez

- Problémák megfeleltetése

- Tesztelési probléma: **Átmenet kombinációk fedése**

- Minden egymás után lehetséges n hosszúságú átmenet sorozat fedése a teszt szekvenciával
 - A teszt szekvencia vigyen vissza a kezdeti állapotba
 - Legegyszerűbb eset: Minden lehetséges **átmenet-pár** fedése



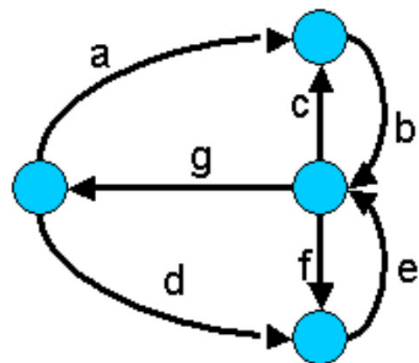
- Gráfelméleti probléma: **„Bankrabló” probléma**

- (Legrövidebb) élszekvencia, amiben minden lehetséges n hosszú élsorozat előfordul (legegyszerűbb eset: $n=2$)

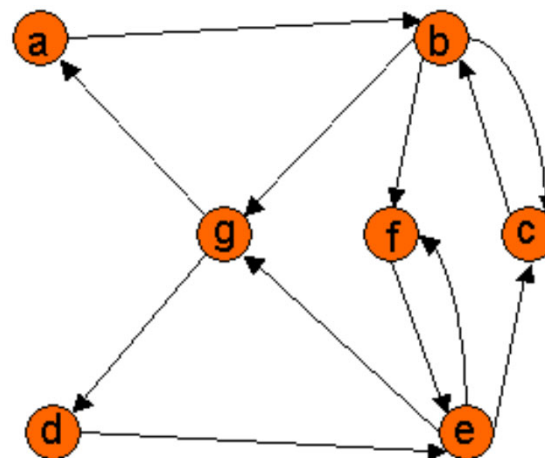
- Megoldás (de Bruijn algoritmus) alapötlete ($n=2$):

- Duális gráf megkezdése: Az eredeti gráf éleiből helyek lesznek
 - Az eredeti gráfban létező élpárok esetén él behúzása a duális gráfba az élek által adott helyek közé
 - A duális gráf kiegészítése (élek duplikálásával) Euler-gráffá
 - Az így kapott gráfban az Euler-kör adja a teszt szekvenciát

Egy példa átmenet kombináció fedéshez



Eredeti gráf



Duális gráf az élpárokkal

Eredeti bejárási szekvencia az élek fedéséhez:

a b c b f e g d e g

Pl. a b, g élpár nincs lefedve!

Bejárási szekvencia a duális gráf alapján élpárok fedéséhez:

a b c b f e c b g d e f e g

Gráfelméleti algoritmus konkurens átmenet fedéshez

- Problémák megfeleltetése

- Tesztelési probléma:

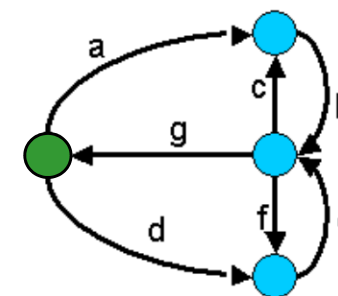
- Konkurens tesztelés átmenetek fedéséhez**

- Teljes átmenet fedés a cél, de több tesztelő van
 - Célszerű egyenletesen megosztani a problémát, hogy a legrövidebb idő alatt végezzenek; mindegyik a kezdőállapotból kezd
 - Feltétel: Egy bemenettel bárhonnán kezdőállapotba vihető a rendszer

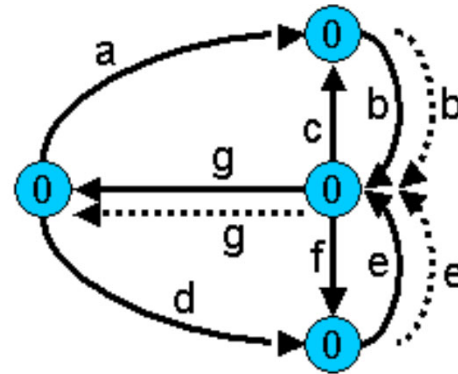
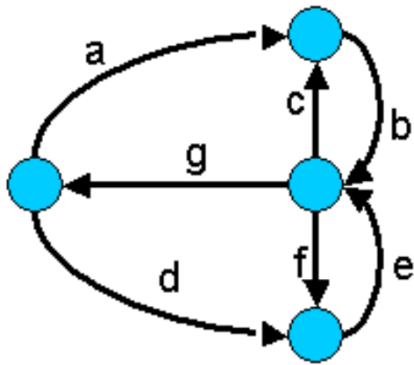
- Gráfelméleti probléma: „Utcaprő brigád” probléma

- Megoldás: Heurisztika (nincs optimális megoldás)

- Egy-egy bejáráshoz **k** felső határ megadása
 - Olyan élszekvencia keresése, amely a legtöbb eddig nem érintett élet tartalmazza, de legfeljebb **k** hosszú; a végén kezdőállapotba vezérelve a bejárást
 - Ezután újabb élszekvenciák felvétele, amíg van be nem járt él
 - A **k** felső határral lehet próbálkozni



Egy példa átmenet fedéshez



Eredeti bejárási szekvencia (Euler-kör):

a b c b f e g d e g

Egy lehetséges (nem optimális) megosztás:

- Tesztelő 1: a b c b f e g (7 időegység kell)
- Tesztelő 2: d e g

Egy jobb megosztás (heurisztikával):

- Tesztelő 1: a b c b g (5 időegység kell)
- Tesztelő 2: d e f e g

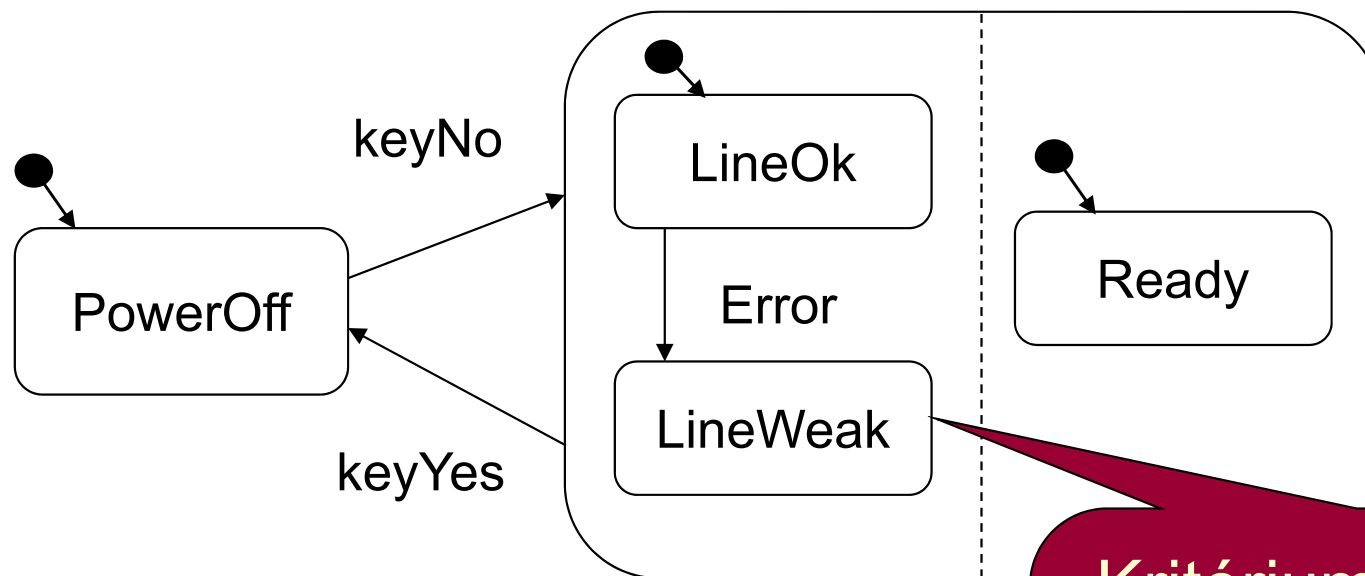
Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - **Modellellenőrzők használata**
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- Tesztgenerálás hibakészlet alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

Alapötlet

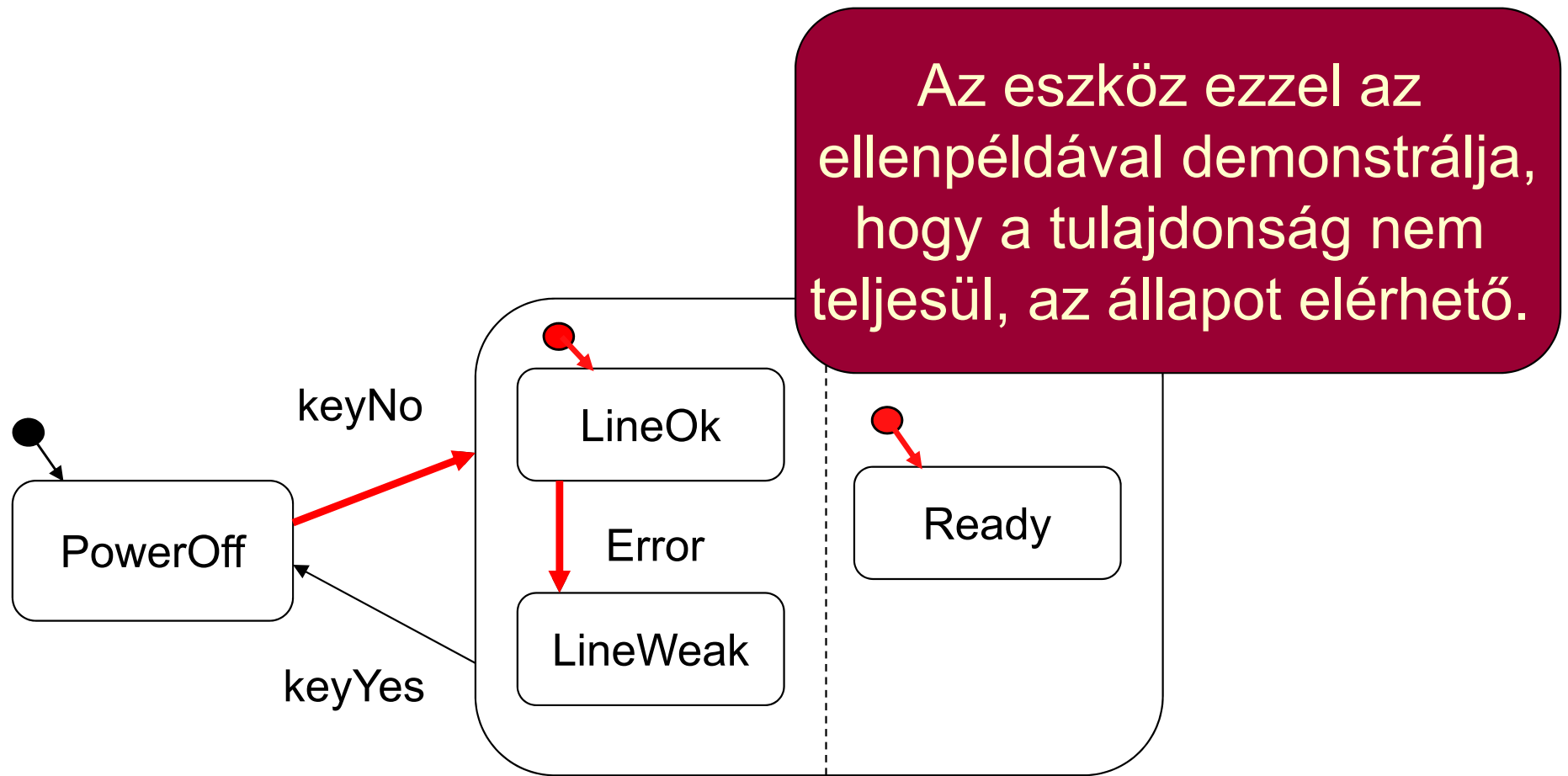
- Tipikus tesztelési kritériumok:
 - Állapotok, átmenetek lefedése
 - Változó definiálások és felhasználások lefedése
 - Be- és kimenő átmenet-párok lefedése egy-egy állapothoz
- Tesztgeneráláshoz szükséges:
 - Állapottér bejárása
 - Modellellenőrző is ezt csinálja
- Alapötlet:
 - Járja be a modellellenőrző az állapottérét!
 - Irányítsuk úgy, hogy az általa adott **ellenpélda** legyen a teszteset!

A modellellenőrző használata tesztgenerálásra



Kritérium megadása:
A LineWeak állapotot
soha sem lehet elérni:
¬ (EF LineWeak)

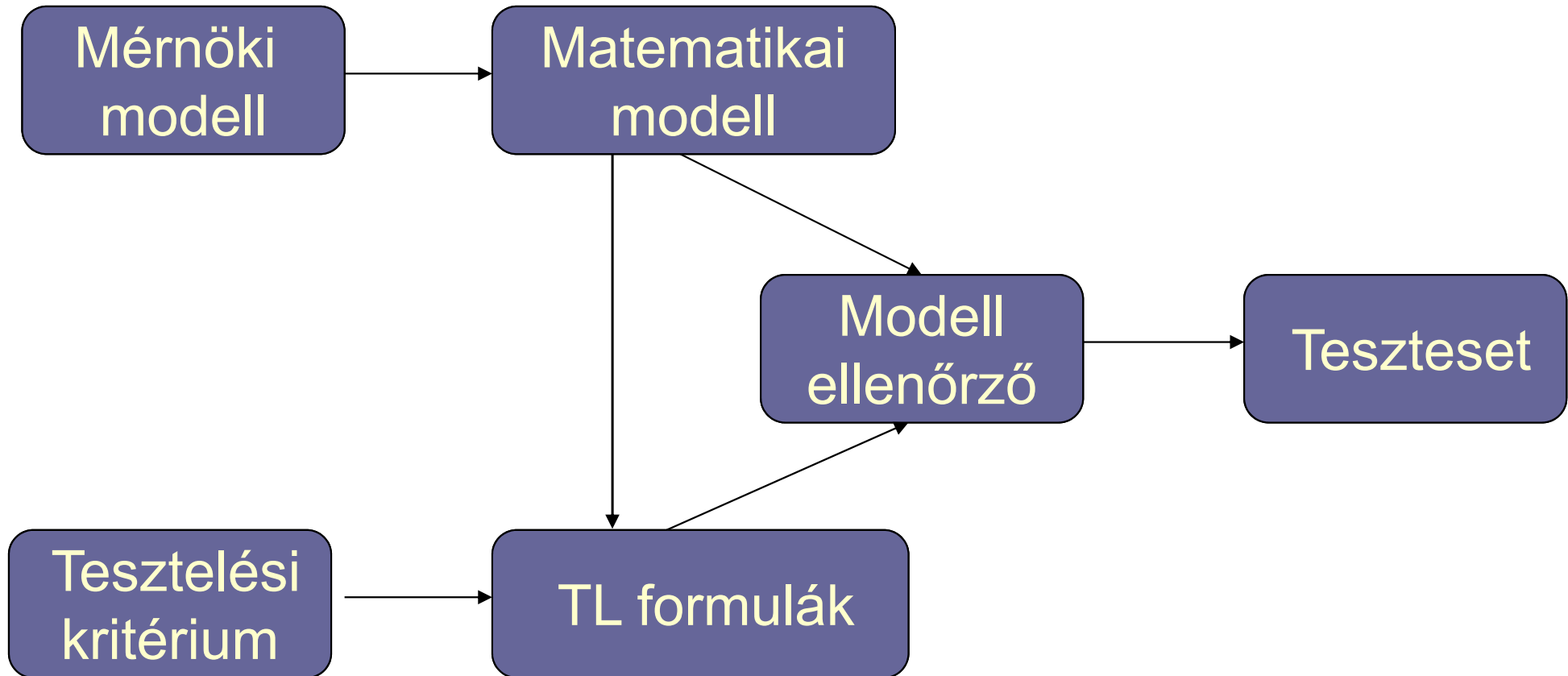
A modellellenőrző használata tesztgenerálásra



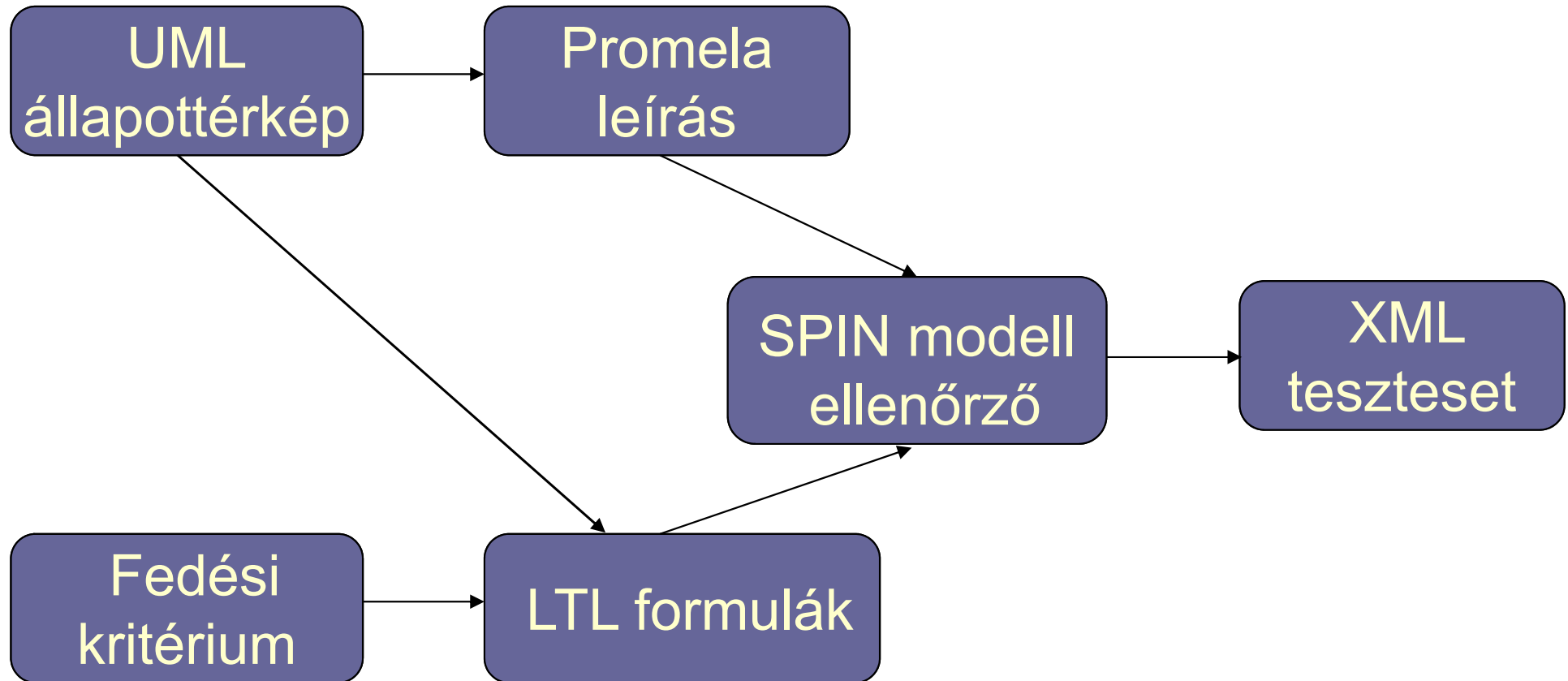
Az eszköz ezzel az ellenpéldával demonstrálja, hogy a tulajdonság nem teljesül, az állapot elérhető.

Ez viszont pontosan egy, a LineWeak állapotot lefedő teszteset!

Automatikus tesztgenerálás



Egy megvalósítás



Fedettségi kritériumok mint TL kifejezések

- Címkék a modellben v változóra (predikátumok):
 - $\text{def}(v)$
 - $\text{c-use}(v)$
 - $\text{p-use}(v)$
 - $\text{implicit-use}(v)$
- Karakterisztikus függvények (állapotváltozókkal):
 - s : adott s állapotban való tartózkodás
 - t : adott t átmenet tüzelése (állapot és következő állapot)
- Állapothalmazok (\rightarrow predikátumok diszjunkcióval):
 - $d(v)$: minden $\text{def}(v)$
 - $u(v)$: minden c-use vagy p-use
 - $\text{im-u}(v)$: minden implicit use
 - exit : megfelelő állapotok új teszthez (pl. kezdőállapotok)

A változó használata implicit átmenet feltételében.

Implicit átmenet: Helyben maradást jelent (az adott feltétel mellett); ez is tesztelhető.

Vezérlés alapú fedettségi kritériumok

- **Állapotfedés:**

$\{\neg EF s \mid s \text{ alapszintű állapot}\}$

Kritériumhalmaz!

Ha megfelelő stabil állapot is kell újabb teszthez:

$\{\neg EF (s \wedge EF \text{ exit}) \mid s \text{ alapszintű állapot}\}$

(a további képletekben $EF \text{ exit}$ kihagyva)

- **Gyenge átmenet fedés:**

$\{\neg EF t \mid t \text{ átmenet}\}$

- **Erős átmenet fedés:**

$\{\neg EF t \mid t \text{ átmenet}\} \cup$
 $\{\neg EF it \mid it \text{ implicit átmenet}\}$

Erős fedés: Implicit átmenetek (helyben maradás) is tesztelve

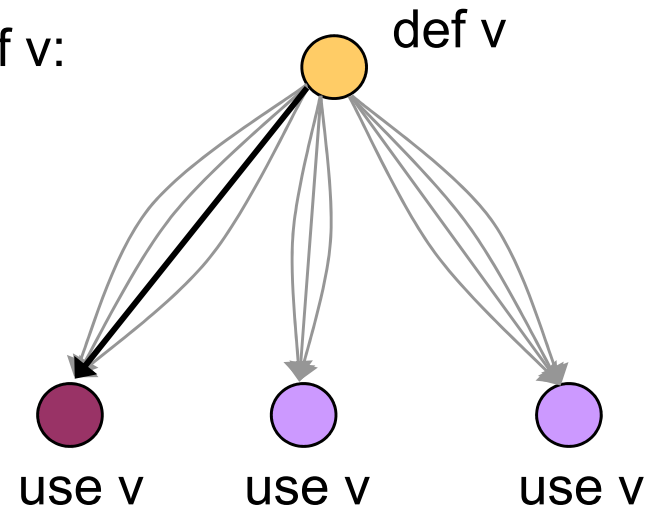
Adatfolyam alapú fedettségi kritériumok (ismétlés)

- **All-defs:**

minden v , minden $\text{def } v$:

egy def-clear
útvonal:

egy $\text{use } v$:

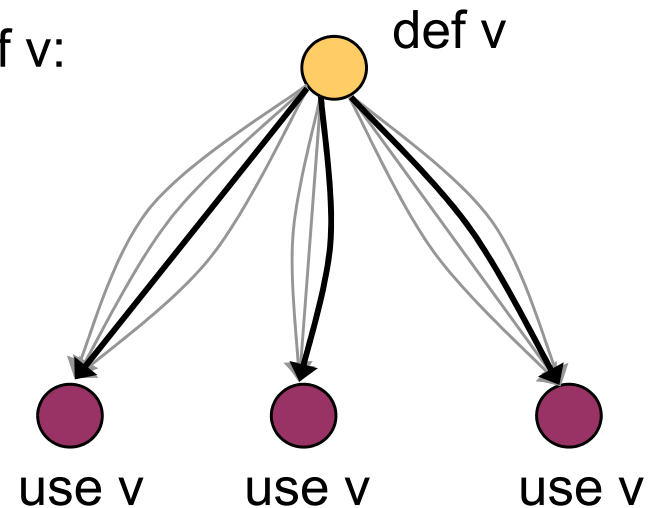


- **All-uses:**

minden v , minden $\text{def } v$:

egy def-clear
útvonal:

minden $\text{use } v$:



Adatfolyam alapú fedettségi kritériumok

- Gyenge all-defs fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup u(v))) \\ | v \text{ változó, } t \in d(v)\}$$

Egy def-clear útvonal tesztelve minden def(v) és egy use(v) között

- Gyenge all-uses fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup t')) \\ | v \text{ változó, } t \in d(v), t' \in u(v)\}$$

Egy def-clear útvonal tesztelve minden def(v) és minden use(v) között

- Erős all-defs fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup (u(v) \vee \text{im-}u(v)))) \\ | v \text{ változó, } t \in d(v)\}$$

Implicit változó használat (~ helyben maradás feltétele) is tesztelve

- Erős all-uses fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup t')) \\ | v \text{ változó, } t \in d(v), t' \in u(v) \cup \text{im-}u(v)\}$$

Korlátozások

- Modellellenőrző jellegzetességei:
 - Csak egy ellenpéldát generál
 - Így nem generálhatók tesztek olyan fedettségi kritériumokhoz, ahol minden ellenpéldára szükség van
 - Pl. **all-du-paths** kritérium
(minden def-clear útvonal egy def-use párhoz)
- Absztrakt teszt eset adódik
 - Csak a bemeneti szekvencia kötött
 - Elvárt kimeneteket meg kell határozni (szimulációval)
- Nemdeterminisztikus modellek:
 - Egy bemeneti szekvenciához több bejárás (cél állapot)
 - Teszt végrehajtásakor figyelembe kell venni

Optimalizáció

- Modellellenőrző feladata:
 - Állapottér hatékony bejárása: Gyorsan, kis tárigennyel
- A tesztgenerálás célja:
Gyorsan **minél rövidebb ellenpéldát találni**
 - **Speciális beállítások** szükségesek a modellellenőrzőben
 - Legrövidebb/legkisebb tesztkészlet kiválasztása:
NP-teljes probléma!
- Lehetőségek (pl. SPIN esetén):
 - **Szélességi keresés** az állapottérben (BFS)
 - Mélységi keresés, de **mélységkorláttal** (limited DFS)
 - Rövidebb ellenpélda **iteratív** keresése
 - **Közelítő** modell ellenőrzés (hash fv. az állapottároláshoz)
 - Bizonyos állapotokat nem jár be a keresés során
 - De ha talál ellenpéldát, az valós teszt lesz

Tesztgenerálási eredmények

Options (compile or run-time)	Time required for test generation	Length of the test sequences	Longest test sequence
-i	22m 32.46s	17	3
-dBFS	11m 48.83s	17	3
-i -m1000	4m 47.23s	17	3
-l	2m 48.78s	25	6
default	2m 04.86s	385	94
-l -m1000	1m 46.64s	22	4
-m1000	1m 25.48s	97	16
-m200 -w24	46.7s	17	3

Paraméterek:

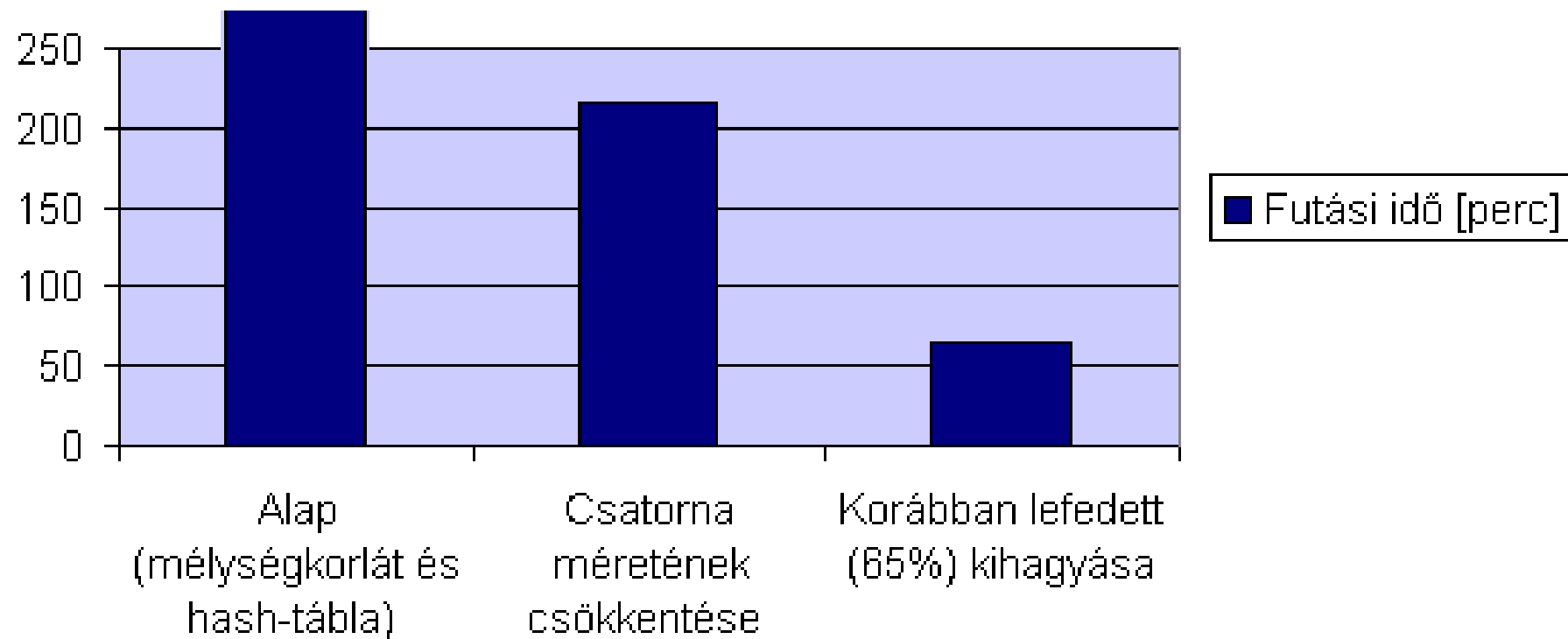
- -i iteratív, -l közelítő iteratív
- -dBFS szélességi keresés
- -m mélységi keresés korlátja
- -w hash tábla korlátja

Mobiltelefon viselkedését leíró
állapotgép (10 állapot, 11
átmenet)

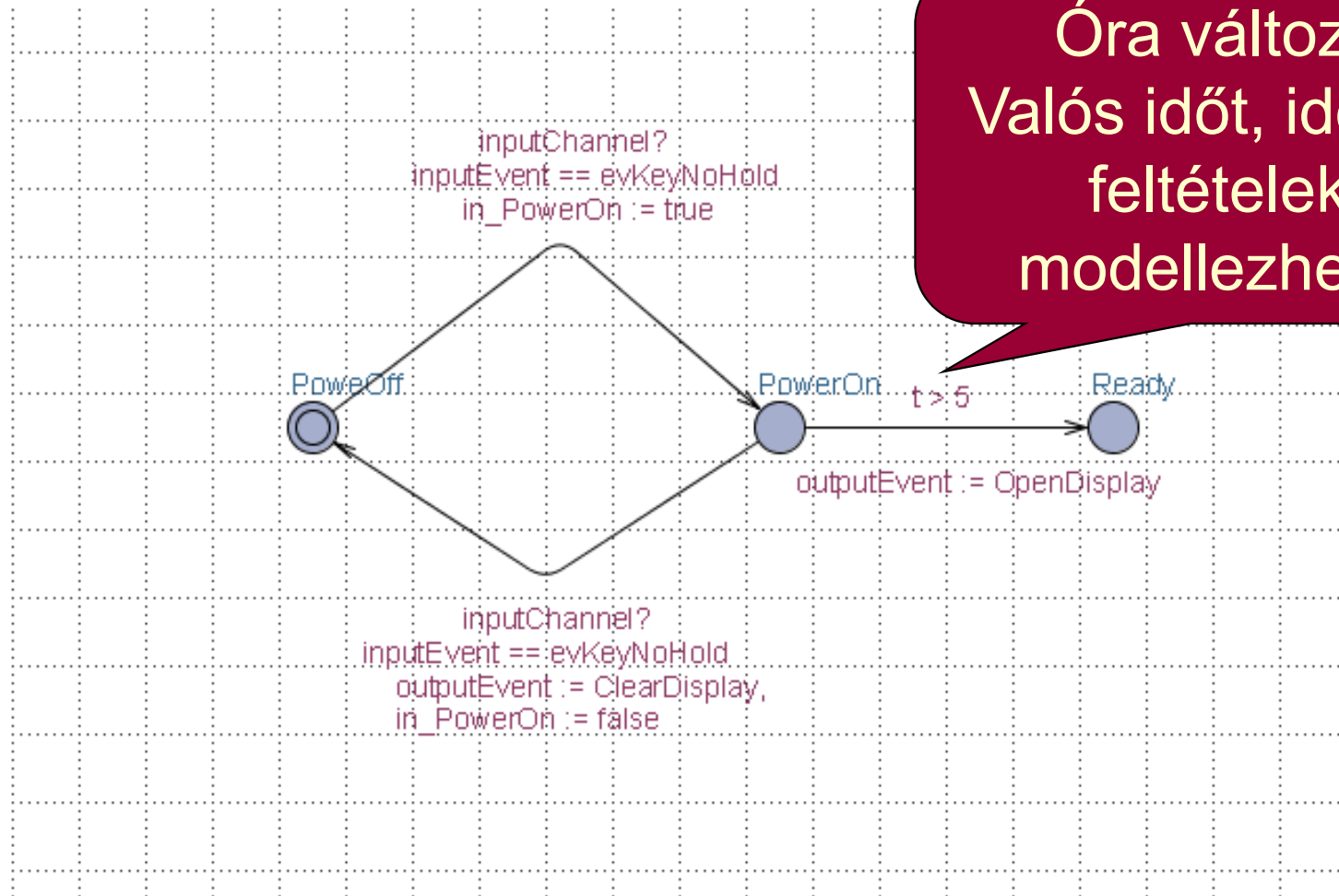
„Bitszinkronizációs protokoll” példa

- Példa: Bitek szinkronizálása egy elosztott rendszerben
 - 5 objektum, 31 állapot, 174 átmenet
 - $2e+08$ bejárando állapot
- Más technikák is kellenek:
 - Erősen tömörítő állapottárolás alkalmazása (bitstate hashing)
 - Szűkítések a modellben: csatorna méret csökkentés
 - Korábban lefedett kritériumok kihagyása
- További heurisztikák alkalmazása:
 - Mélyen fekvő állapotok tesztelése előbb

„Bitszinkronizációs protokoll”: Tesztek generálása teljes állapotfedéshez



Kiterjesztés valósidejű rendszerekre



Óra változók:
Valós időt, időzítési
feltételeket
modellezhetünk

Időzített automaták használata

Speciális modell ellenőrző: UPPAAL

Generált tesztek

State:

(input.sending mobile.PowerOn mobile1.LineOK mobile2.CallWait)
t=0 inputEvent=28 outputEvent=14

Delay: 6

State:

(input.sending mobile.PowerOn r
t=6 inputEvent=28 outputEvent=1

Transitions:

input.sending->input.sendInput { 1, inputChannel!, 1 }

mobile2.CallWait->mobile2.VoiceMail { inputEvent == evKeyYes && t > 5 &&
in_PowerOn, inputChannel?, 1 }

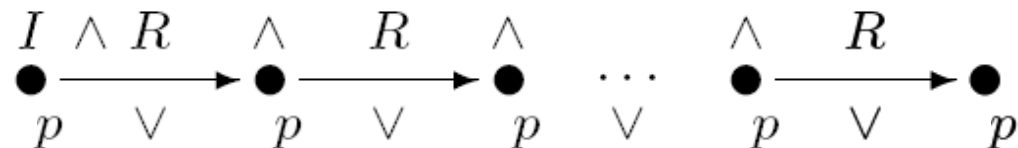
A teszt időzítési
viszonyok is
szerepelnek a
generált
tesztesetben

Tartalomjegyzék

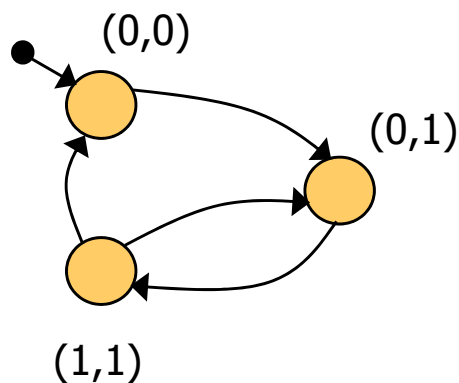
- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - **Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel**
- **Tesztgenerálás hibakészlet alapján**
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

Alapötlet: Korlátos modellellenőrzés alkalmazása

- SAT probléma megoldóinak használata
 - SAT megoldó: Boole függvényekhez keres helyettesítési értéket, ami a függvény értékét igazá teszi
- A modell elemeinek leképezése logikai függvénybe:
 - Kezdőállapotokra vonatkozó predikátum: $I(s)$
 - Elérendő állapotokra vonatkozó predikátum: $p(s)$
 - Állapotátmeneti reláció: $R(s, s')$
 - Lépésenkénti „széthajtogatás”: $R(s_i, s_{i+1})$
- A logikai függvény felírása: Konjunkció
 - Kezdőállapotból indul: Az $I(s)$ predikátum az első állapotra
 - Széthajtogatott átmenetek: Az $R(s_i, s_{i+1})$ reláció alkalmazása
 - Elérendő állapot: A $p(s)$ predikátum valahol fennáll



Példa: A modell leképezése logikai függvénybe

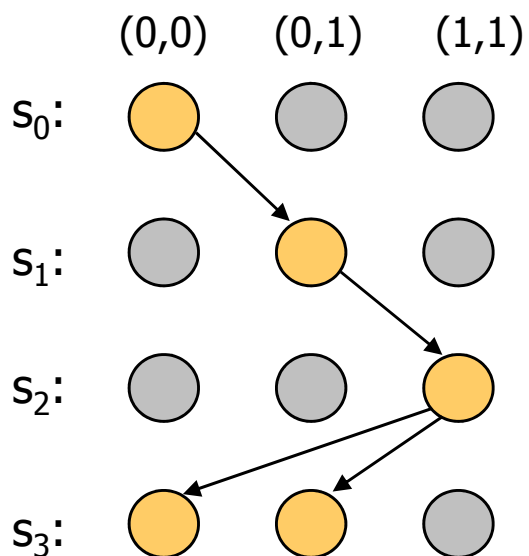


Kezdőállapot predikátum:

$$I(x,y) = (\neg x \wedge \neg y)$$

Állapotátmeneti reláció:

$$R(x,y,x',y') = (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg x' \wedge y') \vee \\ \vee (\neg x \wedge y \wedge x' \wedge y') \vee \\ \vee (x \wedge y \wedge \neg x' \wedge y') \vee \\ \vee (x \wedge y \wedge \neg x' \wedge \neg y')$$



3 lépéses kihajtogatás a kezdőállapotból:

$$I(x_0, y_0) \wedge \\ R(x_0, y_0, x_1, y_1) \wedge \\ R(x_1, y_1, x_2, y_2) \wedge \\ R(x_2, y_2, x_3, y_3)$$

SAT alapú tesztgenerálás fedési kritériumokhoz

- Formula konstruálás:
 - Kihajtogatás k lépésben a kezdőállapotból
 - Teszt kritérium megadása: **TG** formula, pl.:
 - Adott állapot elérése
 - Adott állapotátmenet végrehajtása
 - Adott modellrészlet bejárása, ...

$$\exists s_0, s_1, \dots, s_k : I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1}) \wedge TG$$

The diagram illustrates the decomposition of the SAT formula into three components. The formula is written as $\exists s_0, s_1, \dots, s_k : I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1}) \wedge TG$. Below the formula, three brackets point to the corresponding parts: the first bracket under $\exists s_0, s_1, \dots, s_k$ is labeled "Állapot-szekvencia"; the second bracket under $I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1})$ is labeled "Modell széthajtogatás"; and the third bracket under TG is labeled "Teszt cél".

- Ha ez a formula **kielégíthető**, akkor az egy tesztet ad:
 - A teszt teljesíti a TG kritériumot
 - Ha nem kielégíthető a formula, akkor nincs teszt a kritériumhoz

Használhatóság

- A tesztgenerálás korlátai
 - Legfeljebb adott hosszúságú teszt generálható
 - Iteratíván növelhető a kihajtogatás korlátja
 - Így részleges megoldás adódik
 - Amit megtalál, az biztosan teszt eset lesz
 - Nem garantált, hogy megtalálja a teszt esetet (ha az hosszabb lenne, mint amit figyelembe veszünk)
- A modellből SAT probléma leképezése automatikus
- A TG teszt célok megadása egyszerűsíthető
 - C programokhoz: FQL nyelv teszt célokhoz (FSHELL)
`in /code.c/ cover @line(6),@call(f1) passing @file(code.c) \ @call(f2)`
 - Elő- és utófeltételek megadása:
 - Van-e olyan teszt eset, amikor az utófeltétel nem teljesül?
 - Ellenpélda generálás

Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- **Tesztgenerálás hibakészlet alapján**
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

Hibakészletek használata

- Tapasztalatok a szoftver tesztelés során
 - **Csatolási effektus** (coupling effect): Azok a teszt esetek, amik egyszerű hibákat megtalálnak, bonyolultabbakra is hatékonyak
 - **Kompetens programozó hipotézis**: A programok általában jók, a hibák nagy része gyakran előforduló tipikus hiba
- **Alapötlet**:
 - Állítsunk elő olyan „mutáns” modelleket, amik **tipikus hibákat** tartalmaznak, és generáljunk ezek kimutatására tesztek
 - Ezek várhatóan **bonyolultabb hibákhoz** is jobbak a véletlen tesztekénél
- **Tipikus mutációk**:
 - Aritmetikai operátorok felcserélése feltételekben
 - Akciók (műveletek, üzenetek) sorrendjének megváltoztatása
 - Akciók kihagyása
 - ...

Tesztgenerálás hibakészlet alapján

- A tesztgenerálási feladat:
 - Olyan tesztek előállítása, amelyek **különbséget tesznek** az eredeti (hibamentes) és a mutáns (hibás) viselkedés között
 - Ezek ún. negatív tesztek (sikertelen teszt: nincs hiba!)
- Hogyan definiáljuk a „különbséget” két viselkedés között?
Milyen különbség megengedett?
 - Más viselkedés megengedett-e a specifikált mellett?
 - Több kimenet, más bemenetekre való reakció, ...
 - Kihagyás (elmaradt kimenet) megengedett-e?
- Szokásos megoldások
 - Biztonságkritikus rendszer:
 - Szigorúan a specifikáció szerint
 - Teljes specifikáció szükséges
 - „Hétköznapi” rendszer (akár fejlesztés közben):
 - Beférjen a specifikáció keretei közé

k-ekvivalencia a teszteléshez

- Alkalmazás: Fekete doboz teszteléshez
 - Bemenetek egy s állapotban: $in(s)$ – vezérelhetők
 - Kimenetek egy s állapotban: $out(s)$ – megfigyelhetők
 - Kimeneti akció hiánya is formalizálható: Speciális δ akció
- A k-ekvivalencia definíciója:

Azonos bemeneti sorozat mellett azonos kimenetek az első k lépésre

- Jelölések:

Kezdeti állapot predikátum:

Állapotátmeneti reláció:

Eredeti M modell:

$I(s_0)$

$R(s_i, s_{i+1})$

Mutáns M' modell:

$I'(s'_0)$

$R'(s'_i, s'_{i+1})$

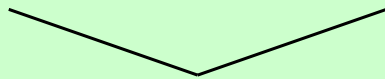
A modell kihajtogatása k lépésre: $I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1})$

Mutáció alapú tesztgenerálás k-ekvivalencia alapján

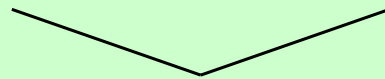
- SAT formula konstruálás a k-ekvivalenciához:

- Azonos bemeneti szekvencia mindkét modellre
- Kihajtogatás k lépésben az eredeti modellre
- Kihajtogatás k lépésben a mutáns modellre
- Legalább egy különböző kimenet lesz a kimeneti szekvenciában

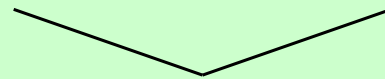
$$\bigwedge_{i=0}^k (\text{in}(s_i) = \text{in}(s'_i)) \wedge I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1}) \wedge I'(s'_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R'(s'_i, s'_{i+1}) \wedge \bigvee_{i=0}^k (\text{out}(s_i) \neq \text{out}(s'_i))$$



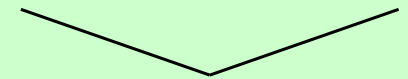
Egyező
bemenetek



Eredeti
modell



Mutáns
modell



Eltérő
kimenet

- Ha ez a formula kielégíthető, akkor az egy tesztet ad

- A teszt különbséget tesz a modellek között:
Kimutatja a mutációt, tehát a hiba felderítésére használható
- Ha a formula nem kielégíthető, akkor ekvivalens a két modell

Mutáció alapú tesztgenerálás az IOCO reláció alapján

- Az IOCO reláció informálisan:
 - Megengedett, hogy azonos bemeneti szekvenciára a **mutáns modell** kimenetei **részalmazát** képezik az eredeti modellben rögzített kimeneteknek (azaz „beleférnek” az eredeti modellbe)
 - Részleges viselkedés (kihagyás) megengedett, eltérő viselkedés nem
 - Többlet funkció megengedett az eredeti modellben nem rögzített bemeneti szekvenciára
 - A k-ekvivalenciánál megengedőbb konformancia reláció
- Definíció (ld. korábban):

Minden, az eredeti modellben felvehető akciószekvenciára igaz:
Az így elérhető **állapotokban** a **mutáns** által nyújtott **kimeneti akciók** részalmazát képezik az **eredeti modell** által nyújtott **kimeneti akcióknak**
- Tesztek generálhatók SAT megoldóval
 - Bonyolultabb a részalmaz reláció vizsgálata miatt (itt nem írjuk fel)

IOCO alapú tesztgenerálás jellegzetességei

- **Teszt eset:**
 - Egy olyan akciószekvencia, ami különbséget tesz az eredeti és a mutáns modell között: kimutatja, hogy nem IOCO ekvivalensek
 - A SAT megoldó miatt korlátos hosszúságú teszt eset
- **Jellegzetességek:**
 - Tartalmazza bemeneti és a kimeneti sorozatot is (nem kell utólagos bejárás)
 - Nemdeterminisztikus modell esetén csak teszt célként fogható fel
 - A δ akció detektálása a teszt végrehajtás során mint **timeout** jelenik meg
 - A timeout elfogadható a specifikációban δ -val jelölt állapotokban (ez az elvárt viselkedés)

Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- Tesztgenerálás hibakészlet alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre I.

- **Tesztelés modell ellenőrzővel**
 - **FSHELL: C programokhoz**
 - CBMC (korlátos modellellenőrző) generálja az ellenpéldát mint teszt szekvenciát strukturális tesztelési kritériumokhoz
 - **BLAST:**
 - Ellenpélda generálás adott teszt célhoz: Absztrakt teszt eset
 - Szimbolikus végrehajtás: Teszt adatok generálása
 - **UPPAAL CoVer, TRON:**
 - Valósídejű rendszerek modellezése: Időzített automaták
 - UPPAAL modell ellenőrző generálja a teszt eseteket
 - Konformancia reláció a teszteléshez:
Relativised timed input-output conformance (RTIOCO)
 - Időkezelés nélkül konzisztens az IOCO relációval

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre II.

- Üvegdoboz tesztelés specifikáció alapján
 - JET: JUnit váz generálása JML elő- és utófeltételek alapján
 - Előfeltétel: Véletlen teszteléshez kötöttséget ad
 - Utófeltétel: Test oracle generálható
 - DART, CUTE, jCUTE, EXE
 - Adott állapothoz vezető bemeneti szekvencia: A feltételeket tartalmazó **kényszerkielégítési probléma** megoldása és szimbolikus végrehajtás
 - Feltételek a SAT bemenetéhez hasonlóan generálhatók
 - SpecExplorer (C#):
 - Spec# specifikáció alapján modell automata képzése (dinamikusan)
 - Bejárás: **Gráfelméleti**, legrövidebb út, vagy véletlen bejárás
 - Konformancia reláció modell és program között: Alternating simulation
 - DOTgEAr (Java):
 - Adatfolyam alapú kritériumok szerinti tesztelés is (all-defs, all-uses)
 - **Evolúciós algoritmussal**, véletlen bejárás alapján indítva és módosítva

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre III.

- Tesztelés absztrakt adattípusok alapján

- Absztrakt adattípus definícióban szereplő axiómák alapján generált tesztesetek

- Axió

Absztrakt adattípusok: hordozó halmaz és műveletek

- Spe

- S

- A

- A

- T

- C

- T

```
Type Boolean is
  sorts Bool
  opns
```

```
  false, true : -> Bool
```

```
  not : Bool -> Bool
```

```
  and : Bool, Bool -> Bool
```

```
  eqns
```

```
  forall x, y: Bool
```

```
  ofsort Bool
```

```
    not(true) = false;
```

```
    not(false) = true;
```

```
    x and true = x;
```


Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre III.

- Tesztelés absztrakt adattípusok alapján
 - Absztrakt adattípus definícióban szereplő axiómák alapján generált tesztesetek
 - Axiómákban szereplő változóknak értékadás
 - Ekvivalencia osztályok, szélső értékek
- Speciális modellezési nyelvek támogatása
 - STG: LOTOS specifikációs nyelv
 - AGATHA: UML, SDL, STATEMATE modellek
 - Kényszerkielégítési probléma megoldása (változók kezelése):
útvonal bejárás feltételek generálása
 - Autolink: SDL és MSC specifikáció alapján
 - TDE/UML: Fedettségi kritériumok és kényszerek megadhatók
 - Conformiq: UML (állapottérkép) modellekhez
 - T-Vec, DesignVerifier, Reactis, AutoFocus: Simulink modellekhez

Összefoglalás

- **Modell alapú tesztgenerálás**
 - Fedési kritériumok teljesítéséhez
 - Vezérlés-orientált: állapotok, átmenetek fedése
 - Adatfolyam-orientált: def-use fedéshez
 - Specifikációval nem konform viselkedés (mutáció) kimutatásához
 - k-ekvivalencia reláció szerint
 - IOCO reláció szerint
- **Eszközök**
 - Direkt (gráfelméleti) algoritmusok
 - Modellellenőrzők: Ellenpélda generálása
 - SAT megoldók: Helyettesítési értékek generálása
 - Planner algoritmusok: Cél-orientált bejárás generálása
 - Kényszerkielégítési problémaként való megoldás
 - Evolúciós technikákkal történő tesztgenerálás